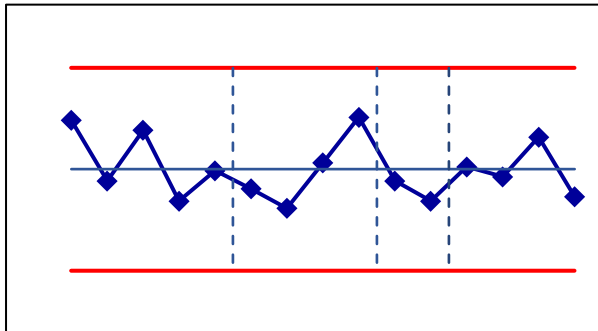


Sterowanie jakością

Wprowadzenie Karty kontrolne



Materiały

<http://pracownicy.uz.zgora.pl/ipajak/>

Jakość jest kategorią filozoficzną, oznaczającą w sensie ogólnym – własność, rodzaj, gatunek, wartość danego przedmiotu, w znaczeniu zaś ściślejszym – cechę lub zespół cech odróżniający dany przedmiot od innych bądź też całokształt cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na jego strukturę wewnętrzną oraz ze względu na jego stosunki, oddziaływania i związki z otoczeniem. *PWN*

Jakość to przewidywany, stopień jednorodności i niezawodności przy możliwych niskich kosztach i dopasowaniu do wymagań rynku. *E. Deming*

Jakość to spełnienie przez produkt określonych wymagań, głównie wymagań nabywców. *P.B. Crosby*

Jakość to ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokajania potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. *PN ISO 8402:1996*

Jakość to stopień, w jakim zbiór *inherentnych właściwości* spełnia *wymagania* (*inherentny* to przeciwny do „przypisany”, oznacza istniejący sam w sobie, szczególnie jako status właściwości, *właściwość* to „cecha wyróżniająca”, a *wymagania* to potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe”).

PN-EN ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia

Jakość to zaspokajanie oczekiwanych potrzeb klienta.

Koncepcje w rozwoju zarządzania jakością

- kontrola techniczna, kontrola jakości (*ang. quality inspection*)
 - kontrola techniczna – decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu wyrobu
 - kontrola jakości – jakości nie da się wymusić działaniami kontrolnymi, jakość należy wytworzyć (jednostki laboratoryjne, badawcze)

- sterowanie jakością (*ang. quality control*)
 - kontrolowanie i korygowanie (regulacja tzn. sterowanie w układzie zamkniętym z pętlą sprzężenia zwrotnego – wykorzystanie informacji o efektach kontroli jakości pozwala na korygowanie procesu wytwarzania)

- zapewnienie jakości (*ang. quality assurance*)
 - planowe i systematyczne działania służące spełnieniu wymagań jakościowych: regularne inspekcje, przeglądy, system zapewnienia jakości jest formalnie opisany, stosowany i monitorowany

- zarządzanie przez jakość (*ang. Total Quality Management*)
 - każdy aspekt działalności przedsiębiorstwa jest podporządkowany zapewnieniu jakości

Sterowanie jakością to część zarządzania jakością ukierunkowana na spełnienie wymagań dotyczących jakości.

Zarządzania jakością to skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości.

Organizacja to grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań.

Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania.

UWAGA 1 Termin "jakość" można stosować z przymiotnikami takimi jak niska, dobra, doskonała.

UWAGA 2 "Inherentny", jako przeciwny do "przypisany", oznacza istniejący sam w sobie, szczególnie jako stała właściwość.

Wymaganie to potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe.

UWAGA 1 "Przyjęte zwyczajowo" oznacza, że istnieje zwyczaj lub powszechna praktyka organizacji jej klientów i innych stron zainteresowanych, że rozpatrywana potrzeba lub oczekiwanie jest przyjęte.

UWAGA 2 Można zastosować kwalifikator do wskazania specyficznego rodzaju wymagania, np. wymaganie dotyczące wyrobu, wymaganie dotyczące zarządzania jakością, wymaganie klienta.

UWAGA 3 Wymaganie wyspecyfikowane jest jednym z wymagań ustalonych, np. w dokumencie

UWAGA 4 Wymagania mogą być stawiane przez różne strony zainteresowane.

Sterowanie jakością obejmuje zarówno monitorowanie procesów (rozumiane jako stałe śledzenie i przekazywanie informacji), jak i eliminowanie przyczyn niezadawalającego wykonawstwa na wszystkich etapach cyklu istnienia wyrobu.

PN-ISO 8402:1994

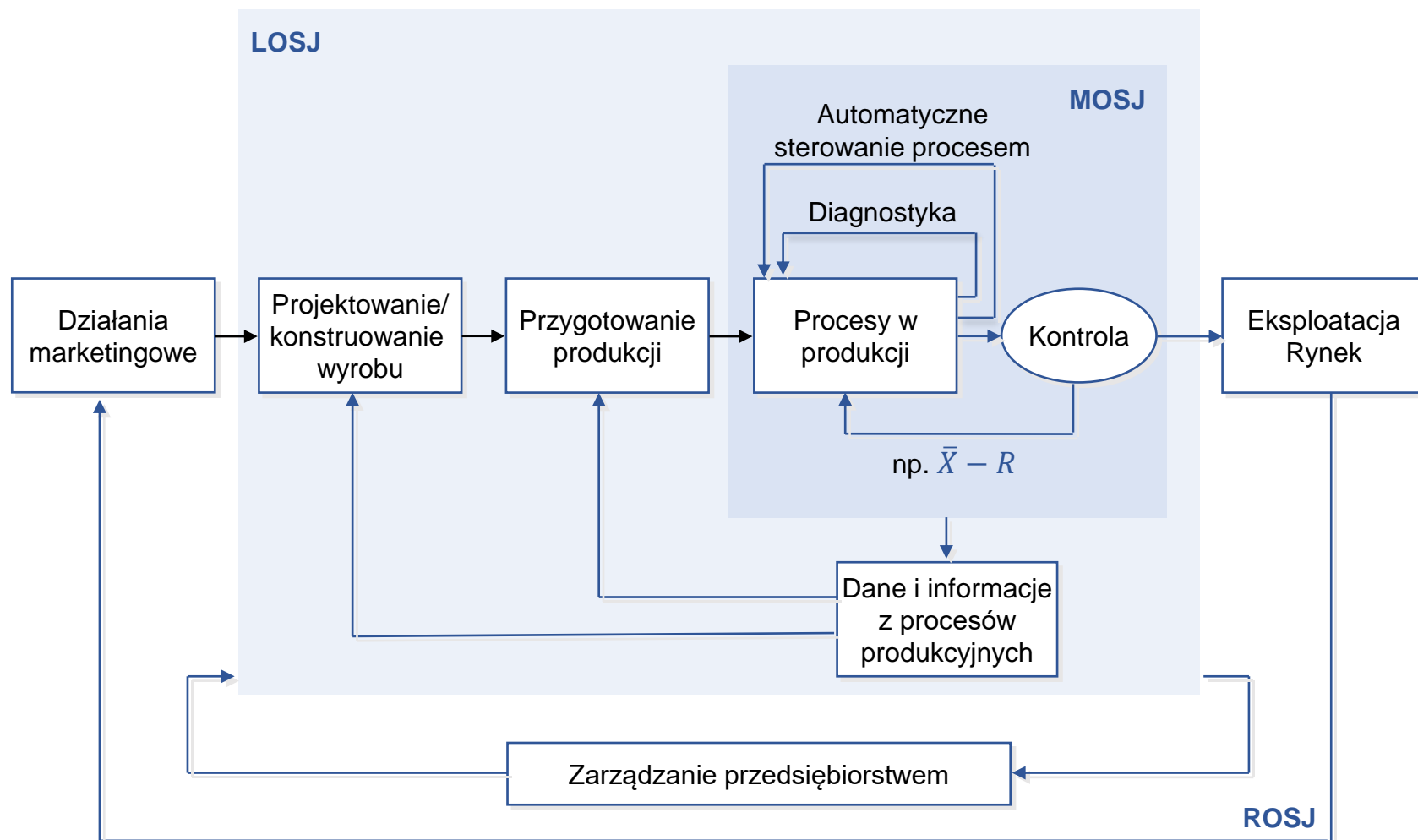
Sterowanie jakością to metody i działania podejmowane w celu spełnienia wymagań jakościowych.

PN-ISO 3534-2:1994

Zasięg sterowania jakością

- małe obwody sterowania jakością (MOSJ)
wykorzystują dane z jednego stanowiska pracy do sterowania jakością na tym stanowisku, obejmują głównie obszar produkcji
- lokalne obwody sterowania jakością (LOSJ)
wykorzystują dane z przebiegu procesów produkcyjnych do sterowania procesami projektowania wyrobu i planowania produkcji
- rozległe obwody sterowania jakością (ROSJ)
decydują o strategii przedsiębiorstwa

Zasięg sterowania jakością



Obwody sterowania na tle cyklu istnienia wyrobu

A. Hamrol, W. Mantura - Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, z przykładami, PWN 2005

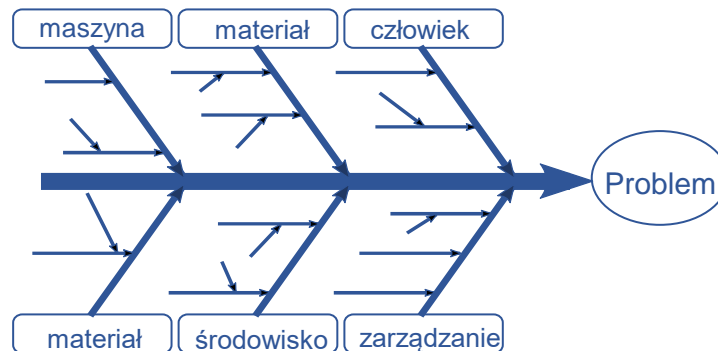
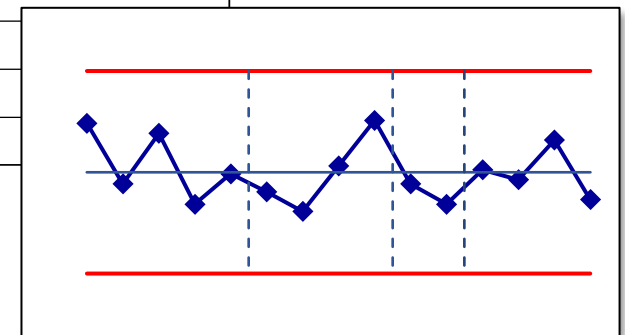
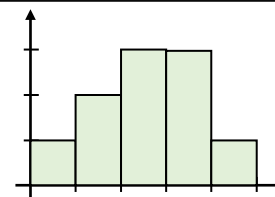
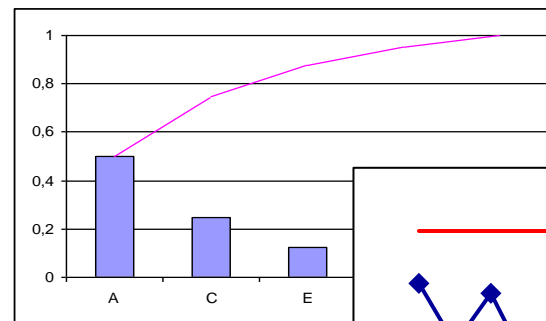
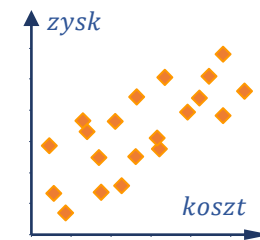
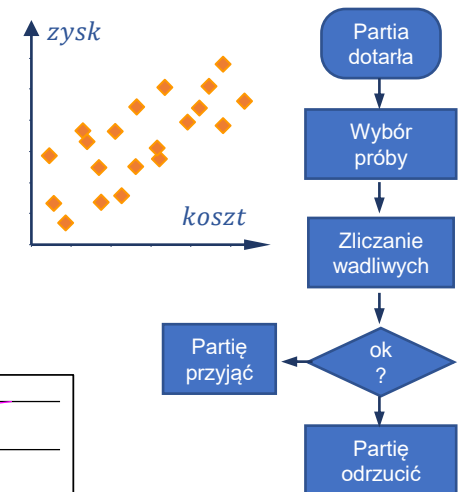
Statystyczne sterowanie procesem

Statystyczne sterowanie procesem (ang. *Statistical Process Control, SPC*) to sterowanie jakością z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, **SPC** to jedno z najczęściej stosowanych podejść w sterowaniu jakością.

W **SPC** najczęściej wykorzystywane są metody należące do siedmiu podstawowych narzędzi sterowania jakością:

- diagram procesu
- karta kontrolna
- arkusz analityczny
- wykres Ishikawy
- diagram Pareto
- histogram
- punktowy diagram korelacji

wada	1	2	3	4	5	Σ
brakujący elem.	II			I		3
uszkodzony elem.	I	I			I	3
zimny lut	II		II	II	III	9
za mało lutu	III	II	I	III	II	11
Razem	8	3	3	6	6	26



Literatura polskojęzyczna

1. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2008
2. Dietrich E., Schulze A.: Metody statystyczne w kwalifikacji środków pomiarowych maszyn i procesów produkcyjnych, Notika System, Warszawa 2000
3. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością, PWN Warszawa 2004
4. Grzenkowicz N., i inni: Zarządzanie jakością – metody i instrumenty controllingu jakości. Wyd. Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009
5. Sałaciński T.: SPC Statystyczne sterowanie procesami produkcji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009

Literatura anglojęzyczna

1. Wild C. J., Seber G. A. F. – *Chance Encounters: A First Course in Data Analysis and Inferencje* – John Wiley & Sons, New York 1999
2. Devore J., Farnym N., Doi J. – *Applied Statistics for Engineers and Scientists*, Cengage Learning, Stanford, 2000
3. Montgomery D., *Introduction to Statistical Quality Control* – John Wiley & Sons, New York 2009

Statystyczne sterowanie procesem SPC to sterowanie jakością z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, SPC to jedno z najczęściej stosowanych podejść w sterowaniu jakością.

W SPC jednym z częściej wykorzystywanych narzędzi są *karty kontrolne*, których twórcą jest Walter Andrew Shewhart.



Karty kontrolne są narzędziem pozwalającym na wykrywanie nielosowych (specjalnych) czynników zakłócających przebieg monitorowanego procesu produkcji. Parametry określające jakość procesu są zmiennymi losowymi, metody statystyczne pozwalają więc ocenić rodzaj zakłóceń wpływających na zmiany wartości badanych zmiennych.

Shewhart wyodrębnił:

czynniki naturalne (losowe) – przyczyny te są trudne do zidentyfikowania, czynników tych ich wiele, ich oddziaływanie na proces krótkotrwałe i niewielkie, źródła przyczyn tkwią w samym procesie, można je zredukować zmieniając technologię, narzędzia itp.,

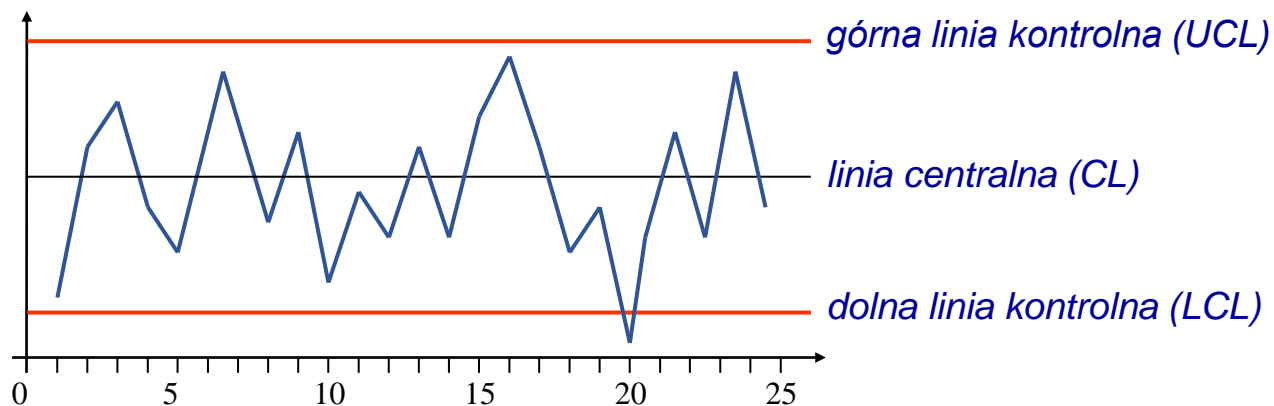
czynniki specjalne (nielosowe) – są łatwiejsze do zidentyfikowania, jest ich niewiele ale oddziałują na proces silnie i długotrwałe.

Podstawowym elementem karty jest *wykres postępu*:

- na osi poziomej wykresu odkładane są numery kolejno pobieranych próbek,
- na osi pionowej wybrana miara obserwowanej zmiennej (średnia, mediana, rozstęp, odchylenie standardowe).

Dodatkowo na wykresie umieszczane są specjalne linie:

- linia centralna (CL) – linia wokół, której oscylują wartości miary, linia ta może być wyznaczana na podstawie założeń technologicznych lub na podstawie próbki pilotażowej,
- linie kontrolne (górną UCL i dolną LCL) – wyznaczające obszar zmienności monitorowanej miary wywołany przyczynami naturalnymi.



Karty kontrolne

W ogólnym modelu karty kontrolnej Shewharta (zakładając, że średnia wartości mierzonej cechy wynosi $\hat{\mu}$ a odchylenie standardowe otrzymanych wyników wynosi $\hat{\sigma}$) linie karty konstruowane są na podstawie zależności:

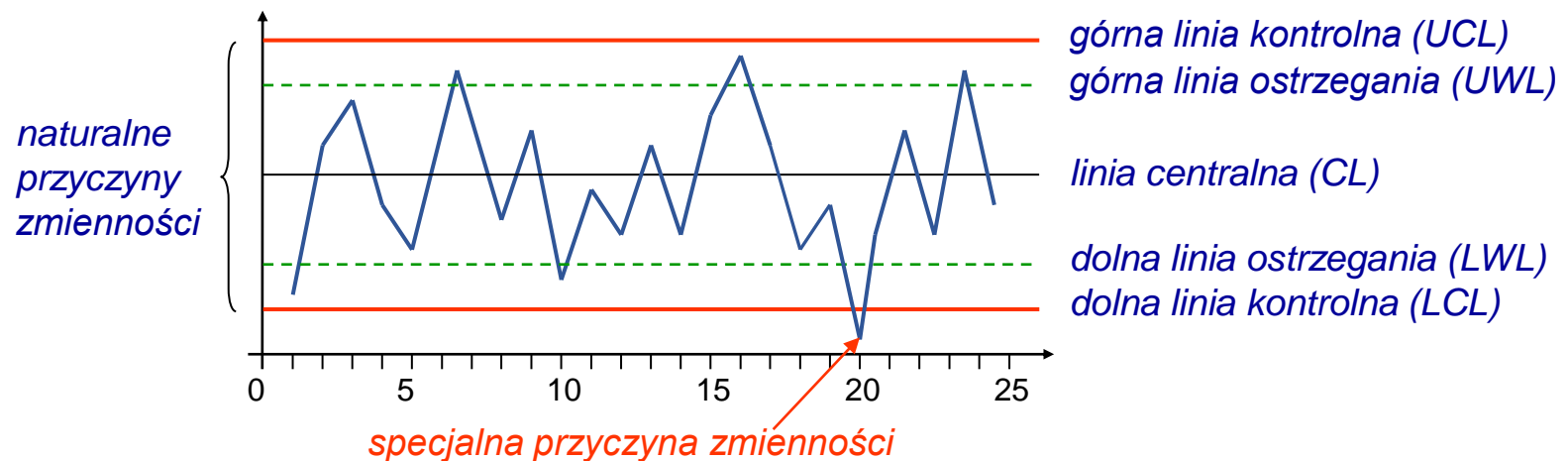
$$LCL = \hat{\mu} - L\hat{\sigma},$$

$$CL = \hat{\mu},$$

$$UCL = \hat{\mu} + L\hat{\sigma}.$$

gdzie: L to odległość granic kontrolnych od linii środkowej wyrażona w jednostkach odchyłeń standardowych, zwykle $L = 3$, na karcie zwykle w odległości $L = 2$ nanoszone są *granice ostrzegawcze*.

Zmienność procesu stabilnego mieści się w granicach kontrolnych. Przekroczenie tych granic świadczy o nielosowym oddziaływaniu i wymusza podjęcie działań korygujących.



Karty kontrolne – idea wykorzystania

Konfiguracja karty

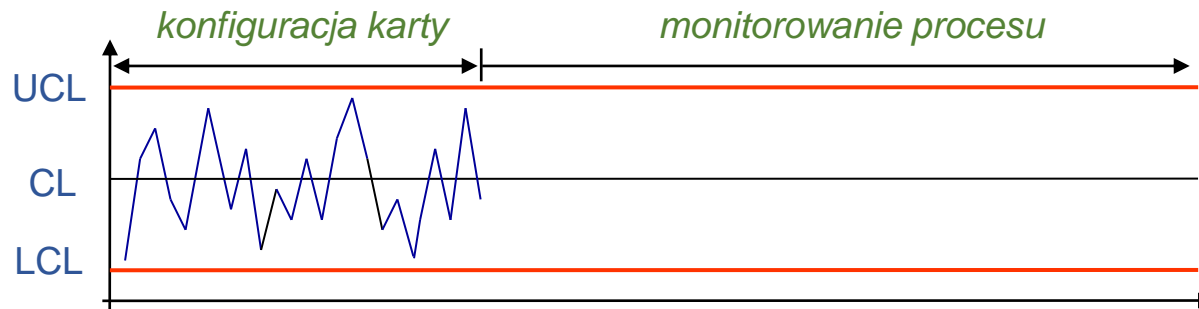
na ogół na podstawie 20 – 30 próbek wyznaczane są *próbne granice kontrolne*,
po wyznaczeniu *granic kontrolnych* sprawdzana jest stabilność procesu:

- jeśli proces jest niestabilny – przyczyny niestabilności są eliminowane wyznaczane są ponownie granice aż do uzyskania stabilności,
- jeśli proces jest stabilny – karta jest skonfigurowana i może być wykorzystana do dalszego monitorowania procesu,

Monitorowanie procesu

punkty wykreślane są na kartach bez zmiany granic,

granice kontrolne są aktualizowane tylko gdy wystąpią istotne zmiany w przebiegu procesu – w tym przypadku ponownie jest przeprowadzana faza konfiguracji.



Karty kontrolne dla cech ciągłych

Dla *mierzalnych* cech monitorowanego procesu (cech ocenianych liczbowo wartościami ciągłymi) których rozkład *jest zgodny z rozkładem normalnym* stosowane są karty:

karta \bar{X} – karta wartości średniej,

karta Me – karta mediany,

karta R – karta rozstępu,

karta S – karta odchylenia standardowego.

(zalecane są próbki o liczebności 5, na karcie powinno być umieszczonych co najmniej 16 – 20 próbek)

Karty kontrolne grupowane są w taki sposób aby umożliwić analizę:

- *poziomu wycentrowania procesu* (poziom ten powinien odpowiadać założonej wartości docelowej),
- *wielkości rozrzutu procesu* (monitorowana cecha nie powinna wykraczać poza założone granice specyfikacji).

Karty kontrolne dla cech ciągłych

Wybór konkretnych kart kontrolnych zależy od liczebności próbki n . Przyjmuje się, że:

- jeśli $1 < n < 10$ to do analizy wykorzystywana jest karta $\bar{X} - R$,
- jeśli $n > 9$ to wykorzystywana jest karta $\bar{X} - S$
(niektórzy używają karty dla próbek od $n \geq 5$),
- $n = 3, 5, 7$ to wykorzystywana jest karta $Me - R$.

Praktyka wskazuje, że stosowanie kart kontrolnych daje dobre rezultaty **niezależnie** od postaci **rozkładu** monitorowanej cechy procesu.

Odporność karty \bar{X} na **rozkład** monitorowanej zmiennej tłumaczy *centralne twierdzenie graniczne* (rozkład średniej z tej próby, niezależnie od typu rozkładu, upodabnia się do normalnego).

Każdy punkt karty \bar{X} odpowiada średniej z próbki:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i,$$

gdzie: x_i – i -ty pomiar próbki, n – liczebność próbki.

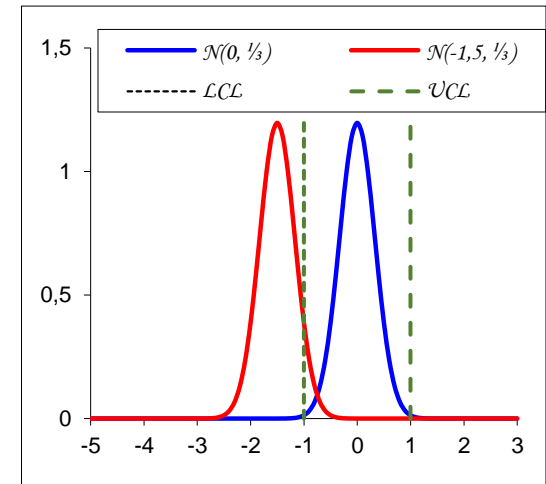
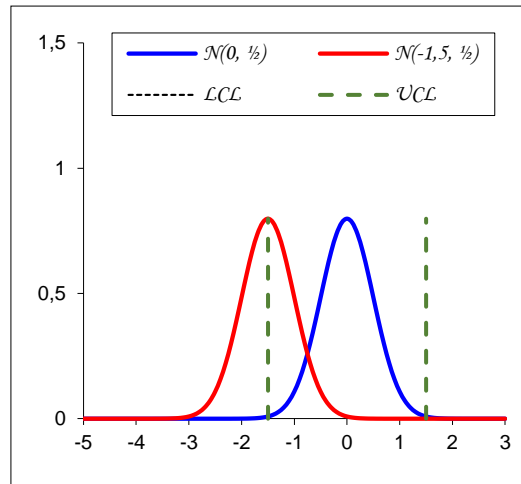
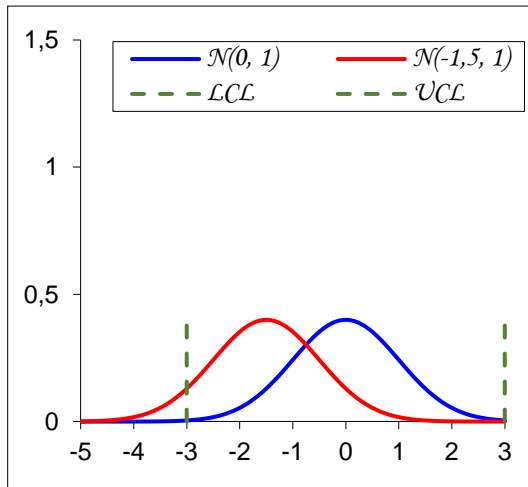
Zakładając, że wyniki pomiarów w próbce mają jednakowy rozkład o wartości oczekiwanej równej μ i odchyleniu standardowym σ i wiedząc, że rozkład średniej dla $n \rightarrow \infty$ jest zbieżny do $\mathcal{N}(\mu, \sigma/\sqrt{n})$, przyjmuje się więc, że odchylenie standardowe danych prezentowanych na wykresie jest równe:

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}.$$

Przedział zmienności zmiennej reprezentującej pojedynczy punkt karty \bar{X} jest więc zależny od liczebności próbki:

- dla $n = 1$: $\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \sigma$,
- dla $n = 4$: $\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \sigma/2$,
- dla $n = 9$: $\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \sigma/3$.

Karta \bar{X} – wrażliwość na przesunięcie średniej



Pewien idealny proces ma rozkład $\mathcal{N}(0, 1)$, proces ten został przesunięty i ma rozkład $\mathcal{N}(-1,5, 1)$. Wykresy a)-c) zestawiają rozkład obydwu procesów (*niebieska krzywa* reprezentuje rozkład idealnego procesu, *czzerwona* reprezentuje rozkład procesu przesuniętego) w sytuacji gdy są one przedstawiane na karcie \bar{X} dla n : a) $n = 1$, b) $n = 4$, c) $n = 9$.

Linie przerywane pokazują linie kontrolne – proces idealny mieści się w założonych granicach kontrolnych, proces rozregulowany w zależności od liczebności próbek:

- w większości mieści się granicach kontrolnych (przesunięcie procesu jest trudne do wykrycia),
- w połowie mieści się w granicach kontrolnych,
- właściwie prawie nie zawiera się w granicach kontrolnych (przesunięcie jest bardzo łatwe do wykrycia).

W ogólnym modelu karty kontrolnej Shewhart linie kontrolne i linia centralna wyznaczone są w oparciu o średnią przedstawianą na wykresie wartości $\hat{\mu}$ i jej odchylenie standardowe $\hat{\sigma}$. W przypadku karty \bar{X} średnia wyników jest średnią ze średnich z próbek:

$$\hat{\mu}_{\bar{X}} = \bar{\bar{x}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{x}_i$$

gdzie: \bar{x}_i – wartość średnia cechy w i -tej próbce, k – liczba próbek.

Do wyznaczenia odchylenia standardowego średnich (n – rozmiar próbki):

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n},$$

konieczne jest szacowanie odchylenia standardowego wyników w próbkach σ , odchylenie to jest przybliżane jako:

$$\sigma = \bar{s} / c_4,$$

gdzie: \bar{s} – wartość średnia z odchyleń standardowych w próbkach, $\bar{s} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k s_i$, s_i – odchylenie standardowe cechy w i -tej próbce, c_4 – współczynnik statystyczny zależny od rozmiaru próbki, $c_4(n)$, zwykle tablicowany (patrz: *tablica 1*) ale może być

również wyznaczany* z zależności: $c_4(n) = \sqrt{\frac{2}{n-1} \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)}}$. $\Gamma()$ – rozkład Gamma.

Karta \bar{X} – wyznaczenie współczynnika c_4

Wariancja populacji może być estymowana na podstawie próby na podstawie wzoru (n – rozmiar próby):

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2. \quad (1)$$

Estymator (1) jest **estymatorem nieobciążonym*** *wariancji* populacji.

Do szacowania *odchylenia standardowego* wykorzystywany jest estymator:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})^2}. \quad (2)$$

Estymator (2) jest **asymptotycznie nieobciążonym** estymatorem odchylenia standardowego** populacji. Dla **małych prób** konieczna jest **korekta** estymatora, korekta ta wykorzystywana jest głównie w zastosowaniach SPC. Wielkość korekty opisuje współczynnik $c_4(n)$, współczynnik ten dąży do 1 przy wzroście liczebności próby.

* Przy wielokrotnym losowaniu elementów próby i uśrednianiu wartości *estymatora nieobciążonego* otrzymywana jest dokładna wartość szacowanego parametru.

** Przy rosnącej liczebności próby wartość *estymatora asymptotycznie nieobciążonego* dąży do dokładnej wartości szacowanego parametru.

Karta \bar{X} – wyznaczenie współczynnika c_4

Jeśli wyniki pomiarów x_i mają rozkład normalny $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ to statystyka: $\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$ ma rozkład χ_{n-1}^2 . Uśrednioną wartość estymatora wyznacza się licząc jego wartość oczekiwaną:

$$\begin{aligned} E(s) &= E\left(\sqrt{\frac{\sigma^2}{n-1} \frac{s^2(n-1)}{\sigma^2}}\right) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n-1}} E\left(\sqrt{\frac{s^2(n-1)}{\sigma^2}}\right) = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n-1}} \int_0^\infty \sqrt{x} \frac{(1/2)^{(n-1)/2}}{\Gamma((n-1)/2)} x^{(n-1)/2-1} e^{-x/2} dx = \\ &= \sqrt{\frac{\sigma^2}{n-1}} \frac{(1/2)^{(n-1)/2}}{\Gamma((n-1)/2)} \frac{\Gamma(n/2)}{(1/2)^{n/2}} \int_0^\infty \underbrace{\frac{(1/2)^{n/2}}{\Gamma(n/2)} x^{n/2-1} e^{-x/2} dx}_{\chi_n^2} = \\ &= \sqrt{\frac{\sigma^2}{n-1}} \frac{(1/2)^{(n-1)/2}}{\Gamma((n-1)/2)} \frac{\Gamma(n/2)}{(1/2)^{n/2}} \underbrace{\hspace{10em}}_{=1} = \\ &= \sigma \sqrt{\frac{2}{n-1}} \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)} = \sigma c_4 \end{aligned}$$

$$E(s) = \sigma c_4 \quad \rightarrow \quad s = \sigma c_4$$

Funkcja gęstości rozkładu χ^2 o k stopniach swobody opisana jest zależnością:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1/2)^{k/2}}{\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, & \text{dla } x > 0, \\ 0, & \text{dla } x \leq 0. \end{cases}$$

Uwzględniając wyprowadzony wcześniej estymator odchylenia standardowego średnich:

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\bar{s}}{c_4\sqrt{n}}.$$

Zgodnie z ogólnym modelem karty kontrolnej:

$$LCL = \hat{\mu}_{\bar{X}} - L\hat{\sigma}_{\bar{X}},$$

$$CL = \hat{\mu}_{\bar{X}},$$

$$UCL = \hat{\mu}_{\bar{X}} + L\hat{\sigma}_{\bar{X}},$$

parametry karty \bar{X} wyznacza się z zależności:

$$LCL = \bar{\bar{x}} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4\sqrt{n}},$$

$$CL = \bar{\bar{x}},$$

$$UCL = \bar{\bar{x}} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4\sqrt{n}},$$

lub stosując podstawienie $A_3 = 3/(c_4\sqrt{n})$:

$$LCL = \bar{\bar{x}} - A_3\bar{s},$$

$$CL = \bar{\bar{x}},$$

$$UCL = \bar{\bar{x}} + A_3\bar{s},$$

gdzie: wartości funkcji $c_4(n)$ i $A_3(n)$ są stabilizowane (patrz tablica 1).

W ogólnym modelu karty kontrolnej Shewhart linie kontrolne i linia centralna wyznaczone są w oparciu o średnią przedstawianej na wykresie wartości $\hat{\mu}$ i jej odchylenie standardowe $\hat{\sigma}$. W przypadku karty S średnia wyników jest średnią z odchyleń standardowych w próbkach:

$$\hat{\mu}_S = \bar{s} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k s_i,$$

gdzie: s_i – wartość odchylenia standardowego w i -tej próbce, k – liczba próbek.

Do wyznaczenia odchylenia standardowego odchyleń standardowych wykorzystywany jest estymator:

$$\hat{\sigma}_S = \sigma \sqrt{1 - c_4^2}.$$

Wariancja s może być wyznaczona z ogólnego wzoru dla wariancji: $D^2(s) = E(s^2) - (E(s))^2$.

Ponieważ estymator $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$ jest nieobciążonym estymatorem wariancji to: $E(s^2) = \sigma^2$.

Wcześniej pokazano, że: $E(s) = \sigma c_4$, więc: $D^2(s) = \sigma^2 - \sigma^2 c_4^2 = \sigma^2(1 - c_4^2)$ i ostatecznie:

$$D(s) = \sigma \sqrt{1 - c_4^2} \rightarrow \sigma_S = \sigma \sqrt{1 - c_4^2}$$

Uwzględniając wyprowadzony wcześniej estymator odchylenia standardowego odchyłek standardowych:

$$\hat{\sigma}_S = \sigma \sqrt{1 - c_4^2} = \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}.$$

Zgodnie z ogólnym modelem karty kontrolnej:

$$LCL = \hat{\mu}_S - L\hat{\sigma}_S,$$

$$CL = \hat{\mu}_S,$$

$$UCL = \hat{\mu}_S + L\hat{\sigma}_S,$$

parametry karty S wyznacza się z zależności:

$$LCL = \bar{s} - 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2},$$

$$CL = \bar{s},$$

$$UCL = \bar{s} + 3 \frac{\bar{s}}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2},$$

lub stosując podstawienia: $B_3 = 1 - \frac{3}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$, $B_4 = 1 + \frac{3}{c_4} \sqrt{1 - c_4^2}$

$$LCL = B_3 \bar{s},$$

$$CL = \bar{s},$$

$$UCL = B_4 \bar{s},$$

gdzie: wartości funkcji $c_4(n)$, $B_3(n)$ i $B_4(n)$ są stabilizowane (patrz tablica 1).

Przy konstrukcji karty wykorzystywana jest statystyka reprezentująca względny rozstęp:

$$W = \frac{R}{\sigma},$$

gdzie: R – rozstęp, σ – odchylenie standardowe.

Zostało pokazane*, że wartość oczekiwana i wariancja zmiennej W wynoszą:

$$E(W) = d_2, \quad D^2(W) = d_3^2.$$

Odchylenie standardowe σ można więc szacować w oparciu o rozstęp :

$$d_2 = \frac{R}{\sigma} \quad \rightarrow \quad \sigma = \frac{R}{d_2}$$

a odchylenie standardowe rozstępu σ_R można wyznaczyć korzystając z odchylenia standardowego zmiennej W :

$$D(W) = d_3 \quad \rightarrow \quad D(R) = D(W)\sigma \quad \rightarrow \quad D(R) = d_3\sigma \quad \rightarrow \quad \sigma_R = d_3\sigma \quad \rightarrow \quad \sigma_R = d_3 \frac{R}{d_2}$$

*Tippett L.H.C., *On the Extreme Individuals and the Range of Samples from a Normal Population*, 1925

$$d_2(n) = \int_{-\infty}^{+\infty} (1 - (1 - \Phi(x))^n - \Phi^n(x)) dx,$$

$$d_3(n) = \sqrt{2 \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy - d_2^2}, \quad f(x, y) = 1 - \Phi^n(y) - (1 - \Phi(x))^n + (\Phi(y) - \Phi(x))^n.$$

Linia centralna na karcie \bar{X} wyznaczana jest w taki sam sposób jak na karcie $\bar{X} - S$:

$$\hat{\mu}_{\bar{X}} = \bar{\bar{x}} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \bar{x}_i.$$

Linie kontrolne wyznaczane są na podstawie odchylenie standardowego średnich $\hat{\sigma}_{\bar{X}}$ z przybliżaniem odchylenie standardowe σ w oparciu o rozstęp, tzn.:

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} \quad \text{i} \quad \sigma = \bar{R}/d_2 \quad \text{czyli:} \quad \hat{\sigma}_{\bar{X}} = \bar{R}/(d_2\sqrt{n}).$$

Zgodnie z ogólnym modelem karty kontrolnej: $LCL = \hat{\mu}_{\bar{X}} - L\hat{\sigma}_{\bar{X}}$, $UCL = \hat{\mu}_{\bar{X}} + L\hat{\sigma}_{\bar{X}}$, $CL = \hat{\mu}_{\bar{X}}$, parametry karty \bar{X} wyznacza się z zależności:

$$LCL = \bar{\bar{x}} - 3 \frac{\bar{R}}{d_2\sqrt{n}},$$

$$CL = \bar{\bar{x}},$$

$$UCL = \bar{\bar{x}} + 3 \frac{\bar{R}}{d_2\sqrt{n}},$$

lub stosując podstawienie $A_2 = 3/(d_2\sqrt{n})$:

$$LCL = \bar{\bar{x}} - A_2\bar{R},$$

$$CL = \bar{\bar{x}},$$

$$UCL = \bar{\bar{x}} + A_2\bar{R},$$

gdzie: wartości funkcji $d_2(n)$ i $A_2(n)$ są tablicowane (patrz tablica 1).

Linia centralna na karcie R jest średnią z rozstępów w próbkach:

$$\hat{\mu}_R = \bar{R} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k R_i.$$

Linie kontrolne wyznacza się uwzględniając wyprowadzony wcześniej estymator odchylenia standardowego rozstępu: $\hat{\sigma}_R = d_3 \bar{R}/d_2$. Zgodnie z ogólnym modelem karty kontrolnej:

$$LCL = \hat{\mu}_R - 3\hat{\sigma}_R,$$

$$CL = \hat{\mu}_R,$$

$$UCL = \hat{\mu}_R + 3\hat{\sigma}_R,$$

parametry karty R wyznacza się z zależności:

$$LCL = \bar{R} - 3d_3 \frac{\bar{R}}{d_2},$$

$$CL = \bar{R},$$

$$UCL = \bar{R} + 3d_3 \frac{\bar{R}}{d_2},$$

lub stosując podstawienia: $D_3 = 1 - 3d_3/d_2$ i $D_4 = 1 + 3d_3/d_2$:

$$LCL = D_3 \bar{R},$$

$$CL = \bar{R},$$

$$UCL = D_4 \bar{R},$$

gdzie: wartości funkcji $d_2(n)$, $d_3(n)$, $D_3(n)$ i $D_4(n)$ są stabilizowane (patrz tablica 1).

Tablica 1 – współczynniki do wyznaczania linii kontrolnych

n	d_2	d_3	c_4	A_2	D_3	D_4	A_3	B_3	B_4
2	1,128	0,8525	0,7979	1,88	0	3,267	2,659	0	3,267
3	1,693	0,8884	0,8862	1,023	0	2,574	1,954	0	2,568
4	2,059	0,8798	0,9213	0,729	0	2,282	1,628	0	2,266
5	2,326	0,8798	0,94	0,577	0	2,114	1,427	0	2,089
6	2,534	0,848	0,9515	0,483	0	2,004	1,287	0,03	1,97
7	2,704	0,8332	0,9594	0,419	0,076	1,924	1,182	0,118	1,882
8	2,847	0,8198	0,965	0,373	0,136	1,864	1,099	0,185	1,815
9	2,97	0,8078	0,9693	0,337	0,184	1,816	1,032	0,239	1,761
10	3,078	0,7971	0,9727	0,308	0,223	1,777	0,975	0,284	1,716
11	3,173	0,7873	0,9754	0,285	0,256	1,744	0,927	0,321	1,679
12	3,258	0,7785	0,9776	0,266	0,283	1,717	0,886	0,354	1,646
13	3,336	0,7704	0,9794	0,249	0,307	1,693	0,85	0,382	1,618
14	3,407	0,763	0,981	0,235	0,328	1,672	0,817	0,406	1,594
15	3,472	0,7562	0,9823	0,223	0,347	1,653	0,789	0,428	1,572
16	3,532	0,7499	0,9835	0,212	0,363	1,637	0,763	0,448	1,552
17	3,588	0,7441	0,9845	0,203	0,378	1,662	0,739	0,466	1,534
18	3,64	0,7386	0,9854	0,194	0,391	1,607	0,718	0,482	1,518
19	3,689	0,7335	0,9862	0,187	0,403	1,597	0,698	0,497	1,503
20	3,735	0,7287	0,9869	0,18	0,415	1,585	0,68	0,51	1,49
21	3,778	0,7272	0,9876	0,173	0,425	1,575	0,663	0,523	1,477
22	3,819	0,7199	0,9882	0,167	0,434	1,566	0,647	0,534	1,466
23	3,858	0,1759	0,9887	0,162	0,443	1,557	0,633	0,545	1,455
24	3,895	0,7121	0,9892	0,157	0,451	1,548	0,619	0,555	1,445
25	3,931	0,7084	0,9896	0,153	0,459	1,541	0,606	0,565	1,435

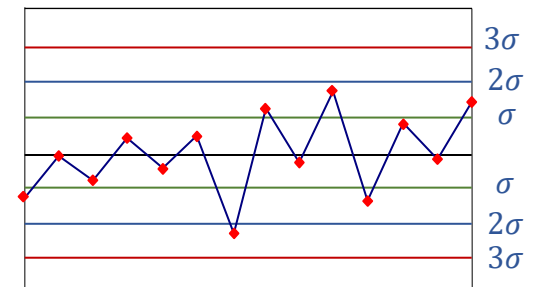
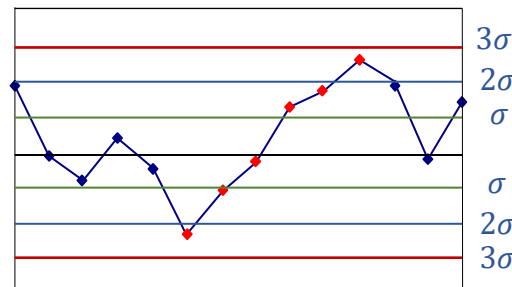
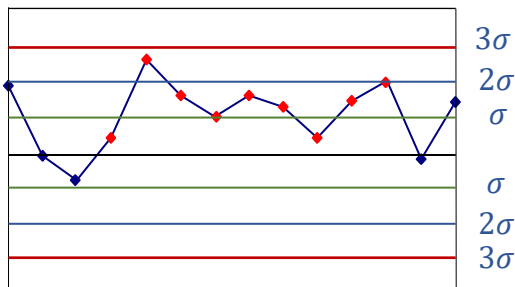
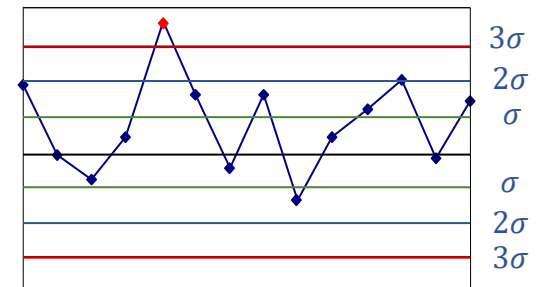
Karty kontrolne – rozregulowanie procesu

Reguły Nelsona

O wpływie nielosowych czynników na proces świadczą pewne układy punktów karty. Wyodrębnione zostały 4 podstawowe i 4 dodatkowe testy przeprowadzane w celu badania statystycznej stabilności procesu. Testy te zostały opublikowane przez L.S.Nelsona w 1984). Przy założeniu *normalności rozkładu*, prawdopodobieństwo wystąpienia każdej z testowanych sytuacji jest niższe od 0,005.

Reguły podstawowe:

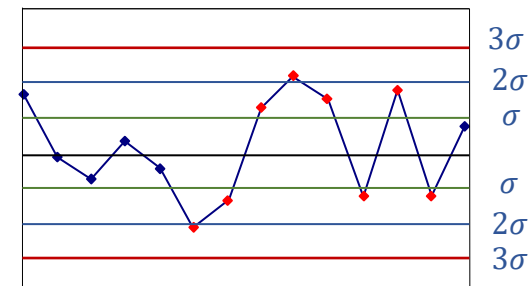
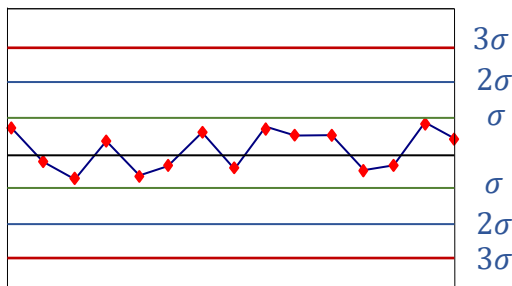
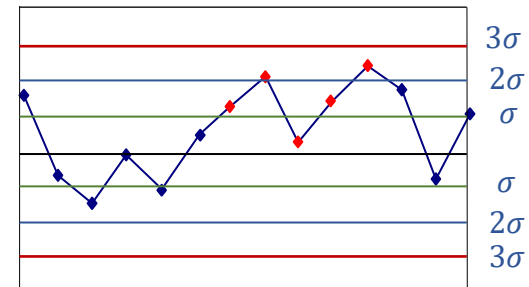
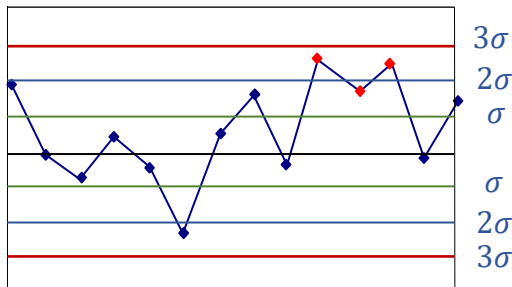
- 1 punkt poza granicą kontrolną,
- 9 kolejnych punktów nad albo pod linią centralną,
- 6 kolejnych punktów stale rosnących lub malejących,
- 14 kolejnych punktów przemiennie rosnących lub malejących (przekroczenie linii centralnej jest niekonieczne)



Karty kontrolne – rozregulowanie procesu

Reguły dodatkowe:

- 2 z kolejnych 3 punktów w odległości przekraczającej 2σ od średniej (w tym samym kierunku),
- 4 z kolejnych 5 punktów w odległości przekraczającej σ od średniej (w tym samym kierunku),
- 15 kolejnych punktów w odległości nie przekraczającej σ po obu stronach średniej,
- 8 kolejnych punktów w odległości przekraczającej σ po obu stronach średniej (żaden z nich w odległości mniejszej od σ).



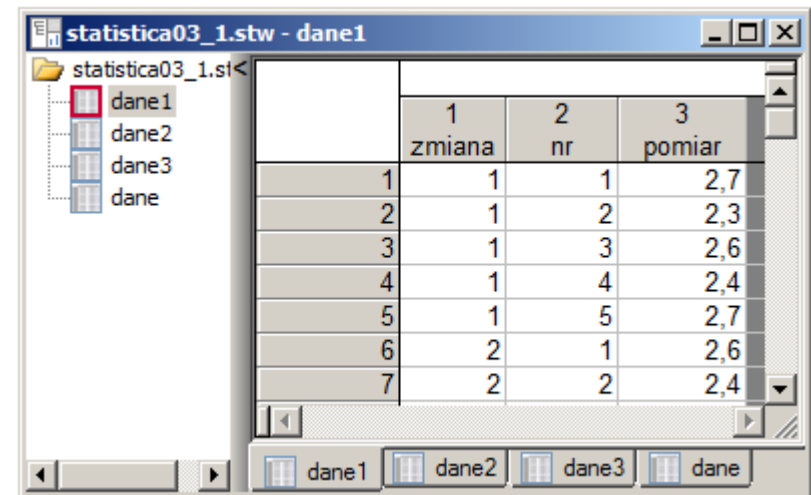
STATISTICA – karta $\bar{X} - R$

Na arkuszu *dane1* zestawione zostały wyniki pomiarów grubości powłoki ochronnej nanoszonej w trakcie produkcji lodówek*. Na 20 kolejnych zmianach wykonano pomiar grubości powłoki dla 5 losowo wybranych lodówek. Wykonaj analizę procesu z wykorzystaniem karty $\bar{X} - R$. Wykorzystując kolejne wyniki pomiarów zapisane w arkuszach *dane2* i *dane3* sprawdź dalszy przebieg procesu.

dane1					
	grubość				
zmiana	1	2	3	4	5
1	2,7	2,3	2,6	2,4	2,7
2	2,6	2,4	2,6	2,3	2,8
3	2,3	2,3	2,4	2,5	2,4
4	2,8	2,3	2,4	2,6	2,7
5	2,6	2,5	2,6	2	2,9
6	2,2	2,3	2,7	2,2	2,6
7	2,2	2,6	2,4	2	2,3
8	2,8	2,6	2,6	2,7	2,5
9	2,4	2,8	2,4	2,2	2,3

Dane pomiarowe zapisano w taki sposób aby pojedynczy pomiar był zapisany w jednym wierszu arkusza danych. Arkusz z danymi zawiera 3 kolumny:

- w kolumnie **zmiana** zapisane zostały numery zmian w których wykonywane były pomiary,
- kolumna **nr** zawiera kolejny numer pomiaru w obrębie zmiany,
- właściwy wynik pomiaru grubości znajduje się w kolumnie **pomiar**.



The screenshot shows the Minitab software interface with a window titled 'statistica03_1.stw - dane1'. The data table is displayed as follows:

	1	2	3
	zmiana	nr	pomiar
1	1	1	2,7
2	1	2	2,3
3	1	3	2,6
4	1	4	2,4
5	1	5	2,7
6	2	1	2,6
7	2	2	2,4

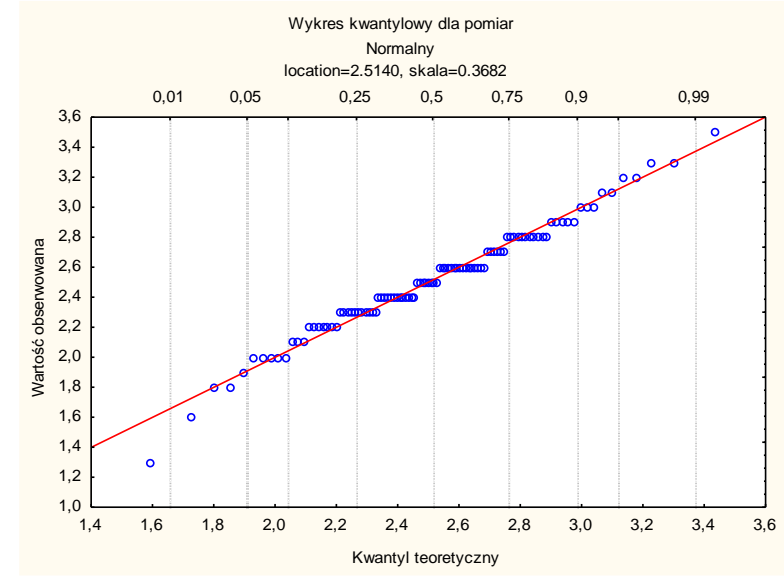
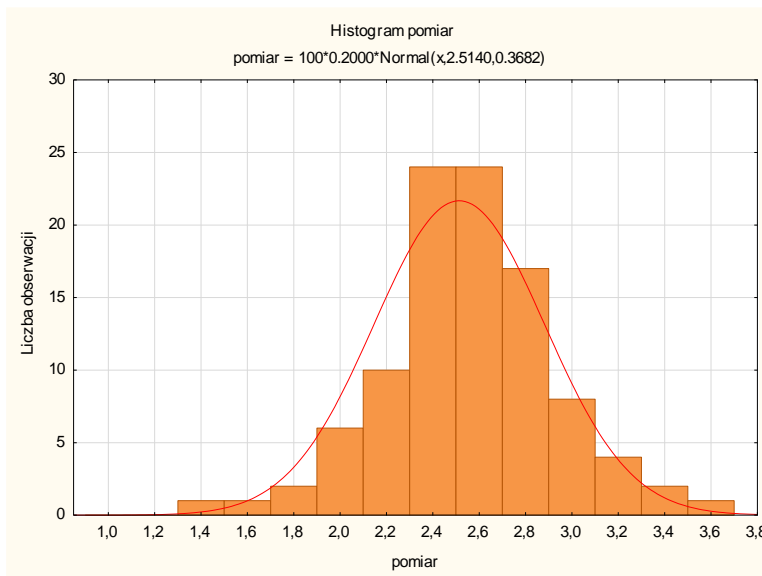
Przed wykonaniem karty przeprowadzony został test zgodności χ^2 sprawdzający spełnienie założenia o normalności rozkładu danych. Graniczny poziom istotności (równy 0,18293) nie pozwala na odrzucenie hipotezy o zgodności rozkładu danych z rozkładem normalnym.

statistica03_1.stw - Zmienna: pomiar, Rozkład: Normalny (dane1 w statistica03_1...

Zmienna: pomiar, Rozkład: Normalny (dane1 w statistica03_1.stw)
 Chi-kwadrat = 10,10089, df = 7 (dopasow.), p = 0,18293

Górna Granica	Obserw. Licznosc	Skumulow. Obserw.	Procent Obserw.	Skumul. % Obserw.	Oczekiwana Licznosc	Skumulow. Oczekiwana
<= 2,0	10	10	10,00000	10,0000	8,13512	8,13512
2,1	3	13	3,00000	13,0000	4,90626	13,04138
2,2	7	20	7,00000	20,0000	6,61619	19,68757

Zmienna: pomiar, Rozkład: Normalny (dane1 w statistica03_1.stw)



STATISTICA – karta $\bar{X} - R$

The image shows the Statistica software interface with the 'Statystyka' menu open. The 'Karty kontrolne' option is highlighted with a red circle. Below the main interface, three dialog boxes are shown, illustrating the configuration of control charts. The top dialog box shows the 'Standardowy tryb pracy' (Standard working mode) selected. The middle dialog box shows the 'Automatyczna aktualizacja' (Automatic update) option selected, which is also circled in red. The bottom dialog box shows the 'Karty X-średnie i R (ocena liczbowa)' (X-bar and R charts (numerical evaluation)) option selected.

Statystyka menu items:

- Modelle zaawansowane
- Wielowymiarowe
- Analiza mocy testu
- Sieci neuronowe
- PLS, PCA, ...
- Karty kontrolne
- Wielowymiarowe
- Analiza procesu
- DOE

Karty kontrolne: dane1 w statistica03_1.stw dialog box options:

- Standardowy tryb pracy: Wszystkie wykresy, karty i arkusze wyników będą iserwane do domyślnego wyjścia (np. skróty raportu itp.)
- Automatyczna aktualizacja: Wszystkie wykresy, karty i arkusze wyników będą umieszczone w osobnych oknach.
- Automatycznie ukrywaj wszystkie wyniki (np. karty nieaktywnej analizy)
- Automatycznie wyświetlaj domyślną kartę kontrolną

Karty kontrolne: dane1 w statistica03_1.stw chart selection options:

- 6 wykresów z kartami X-średnie i R
- 6 wykresów z kartami X-średnie i S
- 6 wykresów z kartami Xi i ruchomego R
- Karty X-średnie i R (ocena liczbowa)**
- Karty X-średnie i S (ocena liczbowa)
- Karty średniej ruchomej X-średnie i R
- Karty średniej ruchomej X-średnie i S
- Karty EWMA X-średnie i R
- Karty EWMA X-średnie i S
- Pojedyncze obserwacje i Rozstęp ruchomy
- Karta CUSUM dla pojedynczych obserwacji
- Analiza Pareto

STATISTICA – karta \bar{X} – R

*definiowanie zmiennych: 1 sposób
(2 zmienne)*

Definiowanie zmiennych dla kart X-średnie i R: dane1 w statistica03_1

Podstawowe | Zbiory | Etykiety, przyczyny, działania

Dane są surowe (średnie itp. będą z nich obliczane) Dane są zagregowane (zawierają średnie itp.)

Zmienne

Pomiary (obserwacje): brak

Identyfikatory próbek (kody): brak

Identyfikatory części (kody): brak

Stała liczność próbek: 3

Stała liczba próbek na część

Minimalna liczba pomiarów: 1

Rozwiń Przybliż Rozwiń Przybliż Rozwiń

Pomiary: 3 Identyf. próbek (opcja): 1 Identyf. części: 1

Pokazuj tylko zmienne o odpowiedniej skali

Wybierz zmienne z pomiarami, identyfikatorami próbek i części

1 - zmiana	1 - zmiana	1 - zmiana
2 - nr	2 - nr	2 - nr
3 - pomiar	3 - pomiar	3 - pomiar

OK

Anuluj

[Zestawy]...

Definiowanie zmiennych dla kart X-średnie i R: dane1 w statistica03_1

Podstawowe | Zbiory | Etykiety, przyczyny, działania

Dane są surowe (średnie itp. będą z nich obliczane) Dane są zagregowane (zawierają średnie itp.)

Zmienne

Pomiary (obserwacje): pomiar

Identyfikatory próbek (kody): zmiana

Identyfikatory części (kody): brak

Stała liczność próbek: 5

Stała liczba próbek na część: 2

Minimalna liczba pomiarów na próbkę: 2

OK

Anuluj

Opcje

Czytanie danych surowych. Program oczekuje serii wyników pomiarów.

SELECT CASES S W

STATISTICA – karta \bar{X} – R

*definiowanie zmiennych: II sposób
(1 zmienna)*

Definiowanie zmiennych dla kart X-średnie i R: dane1 w statistica03_1

Podstawowe | Zbiory | Etykiety, przyczyny, działania

Dane są surowe (średnie itp. będą z nich obliczane) Dane są zagregowane (zawierają średnie itp.)

Zmienne

Pomiary (obserwacje): brak

Identyfikatory próbek (kody): brak

Identyfikatory części (kody): brak

Stała liczność próbek: Stała liczba próbek na część

Minimalna liczba pomiarów

Anuluj

Opcje

Czytanie danych surowych. Program oczekuje serii wyników pomiarów.

Wybierz zmiennę z pomiarami, identyfikatorami próbek i części

1 - zmiana	1 - zmiana	1 - zmiana
2 - nr	2 - nr	2 - nr
3 - pomiar	3 - pomiar	3 - pomiar

Anuluj

[Zestawy]...

Rozwiń Przybliż Rozwiń Przybliż Rozwiń

Pomiary: Identyf. próbek (opcja): Identyf. cz:

Pokazuj tylko zmienne o odpowiedniej skali

Definiowanie zmiennych dla kart X-średnie i R: dane1 w statistica03_1

Podstawowe | Zbiory | Etykiety, przyczyny, działania

Dane są surowe (średnie itp. będą z nich obliczane) Dane są zagregowane (zawierają średnie itp.)

Zmienne

Pomiary (obserwacje): pomiar

Identyfikatory próbek (kody): brak

Identyfikatory części (kody): brak

Stała liczność próbek:

Stała liczba próbek na część:

Minimalna liczba pomiarów na próbkę:

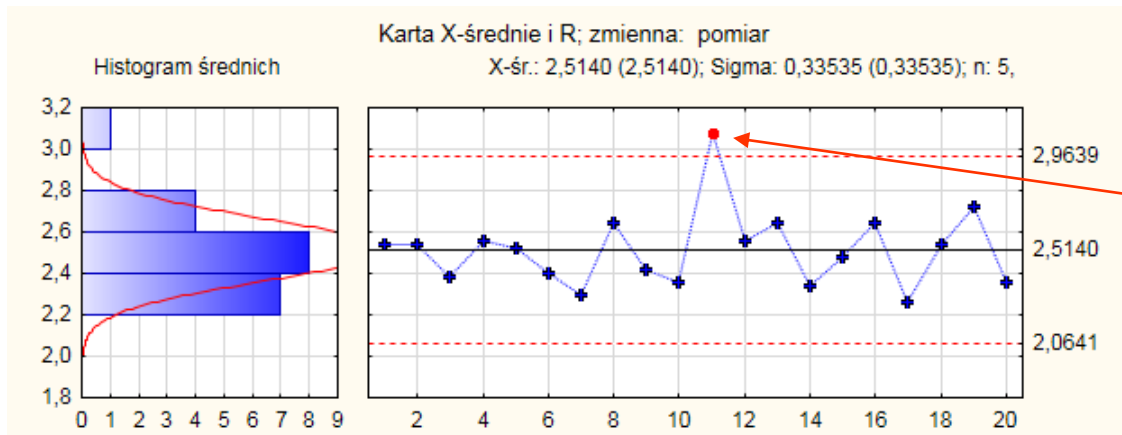
Anuluj

Opcje

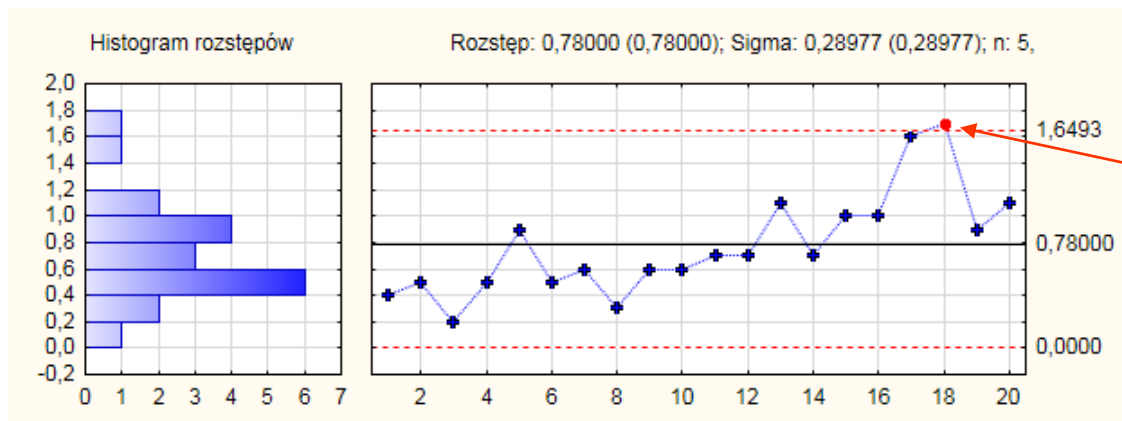
Czytanie danych surowych. Program oczekuje serii wyników pomiarów.

SELECT CASES S W

STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (konfiguracja karty)



próbka 11. poza UCL na karcie \bar{X}



próbka 18. poza UCL na karcie R

Założmy, że przyczyny wystąpienia odstających próbek są nielosowe:

- duża wartość średniej pomiarów w próbce 11. wynika z *błędu operatora*,
- za nielosowy rozstęp pomiarów w 18. próbce odpowiada *uszkodzony miernik*.

STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (konfiguracja karty)

Karty Specyf. X Specyf. R/S
Zbiory Eksploracja Niegaus. Raport

Zmienna: pomiar
Numer próbek: 11
Nazwa: 11

Uwzględnianie próbek
 Wybrane
Próbka << >> 8 9 10 11
M: 3,080000
R: 0,700000
N: 5 Sort. względem próbek

Próbki wskazujące na rozregulowanie:
Poza liniami kontrolnymi, testy konfiguracji
 Zawsze wybieraj ostatnią

Uwzględniaj Nie uwzględniaj w oblicz.
 Nie uwzględniaj na wykresach

Przyczyny Działania Koment.
 Pokaż stat. Raport Ogólne
 Pokaż Ukryj pojedyncze obserwacje

Ustawienia przyczyn, działań i eksploracji: dane1 ...

Dodatkowe informacje (można je określić później)

Przyczyny: brak Działania: brak

Kody uwzględniania próbek (można je określić później)

Nie uwzględniaj Nie uwzględniaj
w obliczeniach: na wykresach i w oblicz.:

Kody:

Kliknij podwójnie na polu edycyjnym aby wybrać z listy kodów

Zmienna z komentarzami (można ją określić później)

Dodaj zmienne do pliku danych

Dodaj zmienne: dane1 w statistica03_1.stw

Liczba nowych zmiennych: 1

Wstaw po zmiennej: pomiar

Nazwa zmiennych: przyczyny

Dodaj zmienne: dane1 w statistica03_1.stw

Liczba nowych zmiennych: 1

Wstaw po zmiennej: przyczyny

Nazwa zmiennych: działania

Dodaj zmienne: dane1 w statistica03_1.stw

Liczba nowych zmiennych: 1

Wstaw po zmiennej: działania

Nazwa zmiennych: wyłącz

Próbka: 11

Zmienna: pomiar
Próbka: 11
Średnia: 3,0800 R: 0,70000 N: 5
Uwzgl. we wszystkich wynikach
Zbiór: Ogół próbek (domyślny)
L.cent. X: 2,5140 R: 0,78000
Sigma X: 0,33535 R: 0,28977
Próbka wskazuje na rozregulowanie
(Poza liniami kontrolnymi, Karta \bar{X} -średnie)

STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (konfiguracja karty)

Ustawienia przyczyn, działań i eksploracji: dane1 ...

Dodatkowe informacje (można je określić później)

Zmienne zawierające przyczyny i działania

Przyczyny: brak Działania: brak

Etykiety tekstowe Etykiety tekstowe

Kody uwzględniania próbek (można je określić później)

Zmienna z kodami: brak

Nie uwzględniaj w obliczeniach: Nie uwzględniaj na wykresach i w oblicz.:

Kody:

Wybierz zmienną z kodami uwzględniania

1 - zmiana
2 - nr
3 - pomiar
4 - przyczyny
5 - działania
6 - wyłącz

Włącz opcję "Pokazuj tylko zmienne o odpowiedniej skali" aby na listach, w zależności od potrzeby, pojawiały się tylko zmienne jakościowe albo ilościowe. Naciśnij F1 aby uzyskać więcej informacji.

Wybierz zmienną z kodami: 6

Pokazuj tylko zmienne o odpowiedniej skali

Wybierz zmienne z kodami dla przyczyn i działań

1 - zmiana
2 - nr
3 - pomiar
4 - przyczyny
5 - działania
6 - wyłącz

1 - zmiana
2 - nr
3 - pomiar
4 - przyczyny
5 - działania
6 - wyłącz

Włącz opcję "Pokazuj tylko zmienne o odpowiedniej skali" aby na listach, w zależności od potrzeby, pojawiały się tylko zmienne jakościowe albo ilościowe. Naciśnij F1 aby uzyskać więcej informacji.

Zmienna z kodami dla przyczyn: 4

Zmienna z kodami dla działań: 5

Pokazuj tylko zmienne o odpowiedniej skali

Ustawienia przyczyn, działań i eksploracji: dane1 ...

Dodatkowe informacje (można je określić później)

Zmienne zawierające przyczyny i działania

Przyczyny: 4 Działania: działania

Etykiety tekstowe Etykiety tekstowe

Kody uwzględniania próbek (można je określić później)

Zmienna z kodami: wyłącz

Nie uwzględniaj w obliczeniach: Nie uwzględniaj na wykresach i w oblicz.:

Kody: 1 2

Kliknij podwójnie na polu edycyjnym aby wybrać z listy kodów

Zmienna z komentarzami (można ją określić później)

Zmienna: brak Etykiety tekstowe

Dodaj zmienne do pliku danych

STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (konfiguracja karty)

Karty | Specyf. X | Specyf. R/S
Zbiory | Eksploracja | Niegaus. | Raport

Zmienna: pomiar
Numer próbek: 11
Nazwa: 11

Uwzględnianie próbek
 Wybrane
Próbka << >>
M: 3,080000
R: 0,700000
N: 5
Sort. względem próbek

Próbki wskazujące na rozregulowanie:
Poza liniami kontrolnymi, testy konfiguracji
 Zawsze wybieraj ostatnią

Uwzględniaj Nie uwzględniaj w oblicz.
 Nie uwzględniaj na wykresach

Przyczyny | Działania | Koment.

Pokaż stat. | Raport | Ogólne
 Pokaż Ukryj pojedyncze obserwacje

Opcje... | Zapisz jako... | Anuluj
Eksploruj... | Aktualizuj
Zabezpiecz
Grupami

Przypisywanie przyczyny: dane1 w s...
Dla próbki: 11
Przyczyna: 1
OK (przypisz)
Określ nową przyczynę | Anuluj

Określ etykiety tekstowe dla przyczyn
1
OK
Anuluj
Nowa
Zmień nazwę
Usuń
Wybierz wszystko

Określ etykiety tekstowe dla przyczyn
operator
OK
Anuluj
Nowa
Zmień nazwę
Usuń
Wybierz wszystko

Przypisywanie przyczyny: dane1 w s...
Dla próbki: 11
Przyczyna: operator
OK (przypisz)
Określ nową przyczynę | Anuluj

Przypisz przyczynę do karty:
 \bar{X} -śred., X, MA, C, P, Np
 R lub S (MR)
 Obu
 Zadnej (usuń)

Ustawienia przyczyn, działań i komentarzy

Wybierz przyczynę/działanie spośród wcześniej zdefiniowanych lub zdefiniuj nową przyczynę/działanie

STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (konfiguracja karty)

Statistica window: X̄r./R: pomiar: dane1 w statistica

Karty | Specyf. X | Specyf. R/S

Zbiory | Eksploracja | Niegaus. | Raport

Zmienna: pomiar
Numer próbek: 11
Nazwa: 11

Uwzględnianie próbek
 Wybrane
 Próbkę << >>
 M: 3,080000
 R: 0,700000
 N: 5
 Sort. względem próbek

Próbkę wskazujące na rozregulowanie:
 Poza liniami kontrolnymi, testy konfiguracji
 Zawsze wybieraj ostatnią
 Uwzględniaj Nie uwzględniaj w oblicz.
 Nie uwzględniaj na wykresach

Statistica window: X̄r./R: pomiar: dane1 w statistica

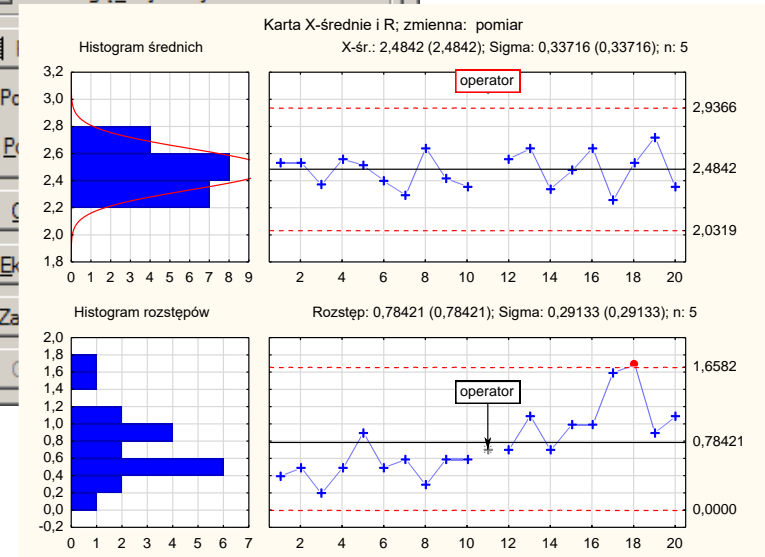
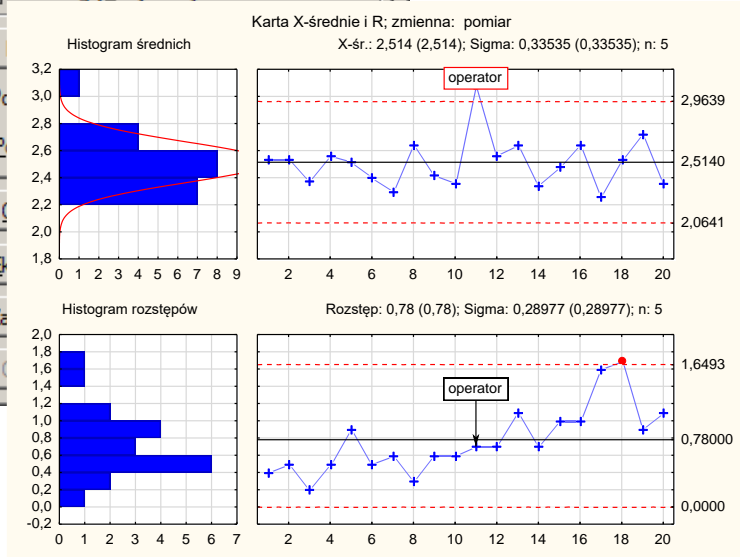
Karty | Specyf. X | Specyf. R/S

Zbiory | Eksploracja | Niegaus. | Raport

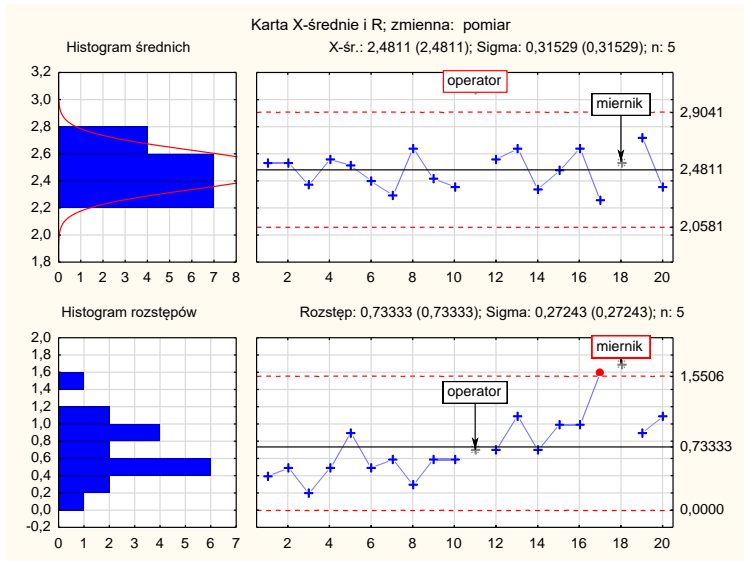
Zmienna: pomiar
Numer próbek: 11
Nazwa: 11

Uwzględnianie próbek
 Wybrane
 Próbkę << >>
 M: 3,080000
 R: 0,700000
 N: 5
 Sort. względem próbek

Próbkę wskazujące na rozregulowanie:
 Poza liniami kontrolnymi, testy konfiguracji
 Zawsze wybieraj ostatnią
 Uwzględniaj Nie uwzględniaj w oblicz.
 Nie uwzględniaj na wykresach

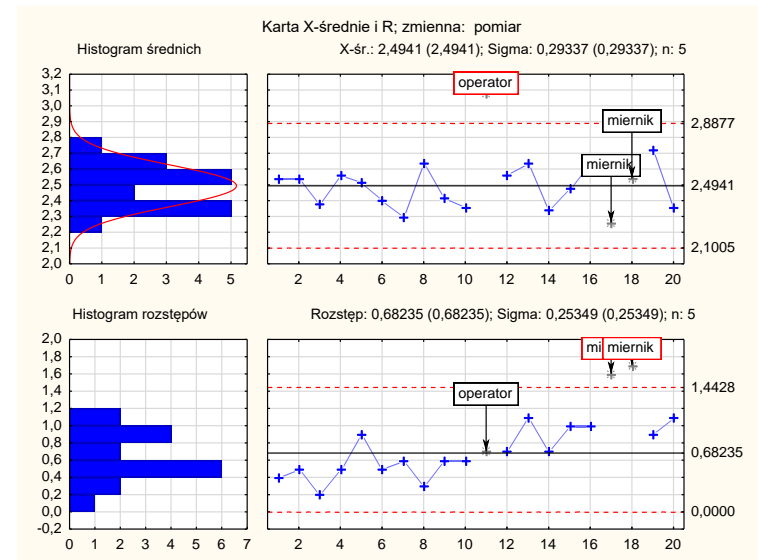


STATISTICA – karta \bar{X} – R – konfiguracja karty



Na zaktualizowanej karcie (po usunięciu nielosowych próbek 11. i 18.) próbka 17. znalazła się poza *UCL* na karcie *R*.

Przyjęto, że za nielosowy rozstęp pomiarów w tej próbce (podobnie jak w następnej) odpowiada *uszkodzony miernik*. W konsekwencji wyniki próbki 17. nie są wykorzystywane do konfiguracji karty.



STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (testy konfiguracji)

Xśr./R: pomiar: dane1 w statistica

Zbiory | Eksploracja | Niegaus. | Raport

Karty | Specyf. X | Specyf. R/S

Specyfikacje dla karty X

Zbiór << >> Ogól próbek (domyślny)

Linia centralna: Średnia procesu

Sigma: Obliczona

UCL: 3,0000 * S

LCL: -3,0000 * S

Linie ostrzegawcze: brak

Jeżeli różne n: Użyj oddzielnych granic

Otwórz specyf. | Zapisz specyf.

Linia średniej ruchomej: Nie Tak

Zdolność procesu **Testy konfigur.**

Opcje... | Zapisz jako... | Anuluj

Eksploruj... | Aktualizuj

Zabezpiecz

Grupami

Xśr./R: pomiar: dane1 w statistica

Zbiory | Eksploracja | Niegaus. | Raport

Karty | Specyf. X | Specyf. R/S

Specyfikacje dla karty R/S

Zbiór << >> Ogól próbek (domyślny)

Linia centralna: Średnia procesu

UCL: 3,0000 * S

LCL: -3,0000 * S

Linie ostrzegawcze: brak

Jeżeli różne n: Użyj oddzielnych granic

Otwórz specyf. | Zapisz specyf..

Zdolność procesu **Testy konfigur.**

Opcje... | Zapisz jako... | Anuluj

Eksploruj... | Aktualizuj

Zabezpiecz

Grupami

STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (testy konfiguracji)

Testy konfiguracji dla karty kontrolnej: dane1 w statisti... ? X

Strefy

C: Od środka do \pm 1.0 * sigma

B: Od strefy C do \pm 2.0 * sigma

A: Od strefy B do \pm 3.0 * sigma

OK (oblicz testy)

Ustaw i zamknij

Anuluj

Wszystkie testy (zaznacz wszystkie)

Liczba kolejnych punktów (próbek)

Po tej samej stronie linii centralnej (w strefie C lub dalej): 9

Trend wzrastający lub malejący: 6

Naprzemiennie w górę i w dół: 14

W strefie A lub dalej: 2 z 3

W strefie B lub dalej: 4 z 5

W strefie C (powyżej lub poniżej linii centralnej): 15

Poza strefą C (powyżej lub poniżej linii centralnej): 8

Wykonaj testy na pokrywających się zakresach

Wykonaj testy dla kart zmienności (R lub S)

Ustaw jako domyślne

Przywróć domyślne

Dane: pomiar ; Testy konfiguracji (dane1 w statistica03_1.stw)

pomiar : Testy konfiguracji (dan
Karta \bar{X} -średnie
Linia centralna: 2,494118 Sigma:

Strefy A/B/C: 3,000/2,000/1,000 *Sigma

Testy konfiguracji	od próbki	do próbki
9 po tej samej stronie l. centralnej	OK	OK
6 w trendzie rosnącym/malejącym	OK	OK
14 naprzemiennie w górę i w dół	OK	OK
2 z 3 w strefie A lub dalej	OK	OK
4 z 5 w strefie B lub dalej	OK	OK
15 w strefie C	OK	OK
8 poza strefą C	OK	OK

Dane: pomiar ; Testy konfiguracji (dane1 w statistica03_1.stw)

pomiar : Testy konfiguracji (dan
Karta R
Linia centralna: 0,682353 Sigma:

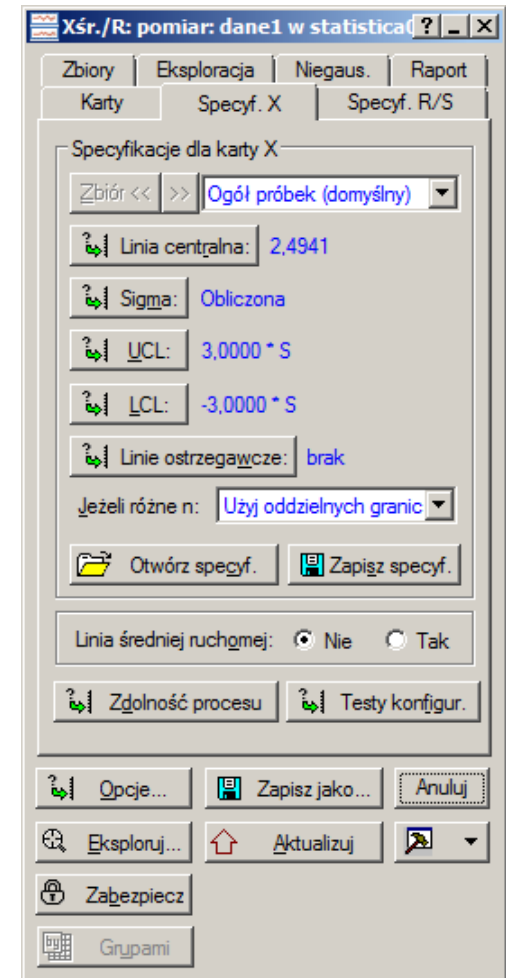
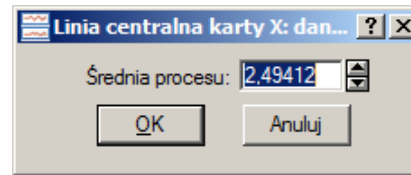
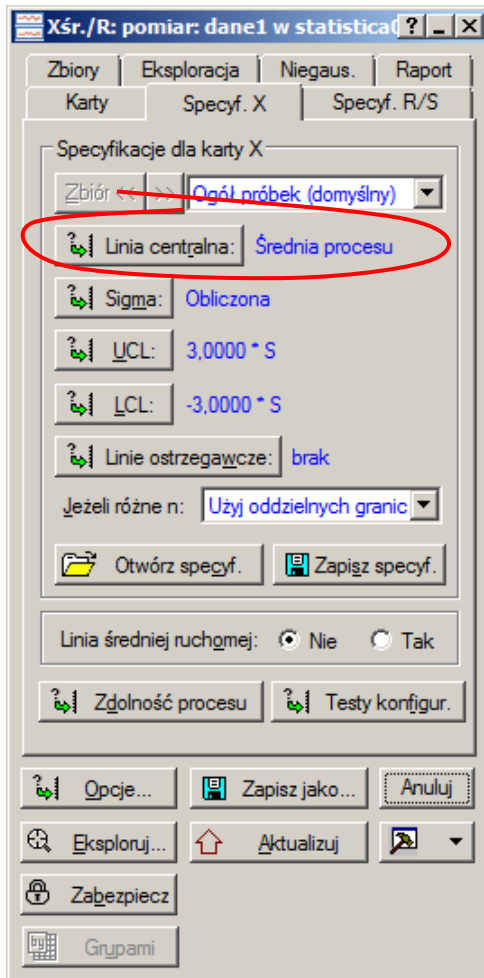
Strefy A/B/C: 3,000/2,000/1,000 *Sigma

Testy konfiguracji	od próbki	do próbki
9 po tej samej stronie l. centralnej	OK	OK
6 w trendzie rosnącym/malejącym	OK	OK
14 naprzemiennie w górę i w dół	OK	OK
2 z 3 w strefie A lub dalej	OK	OK
4 z 5 w strefie B lub dalej	OK	OK
15 w strefie C	OK	OK
8 poza strefą C	OK	OK

proces jest stabilny, można zapisać konfigurację karty

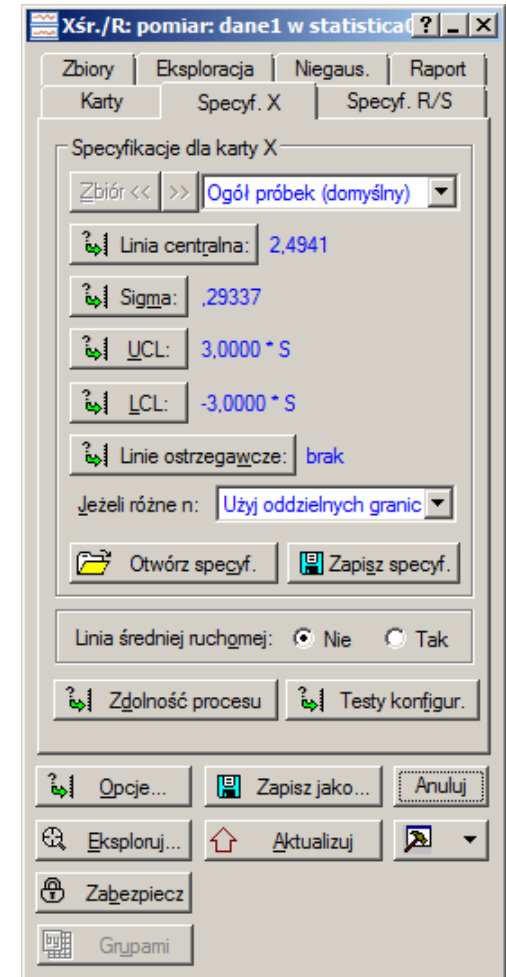
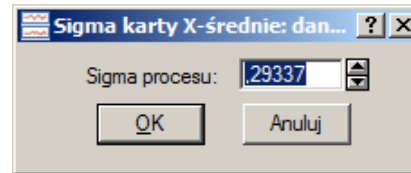
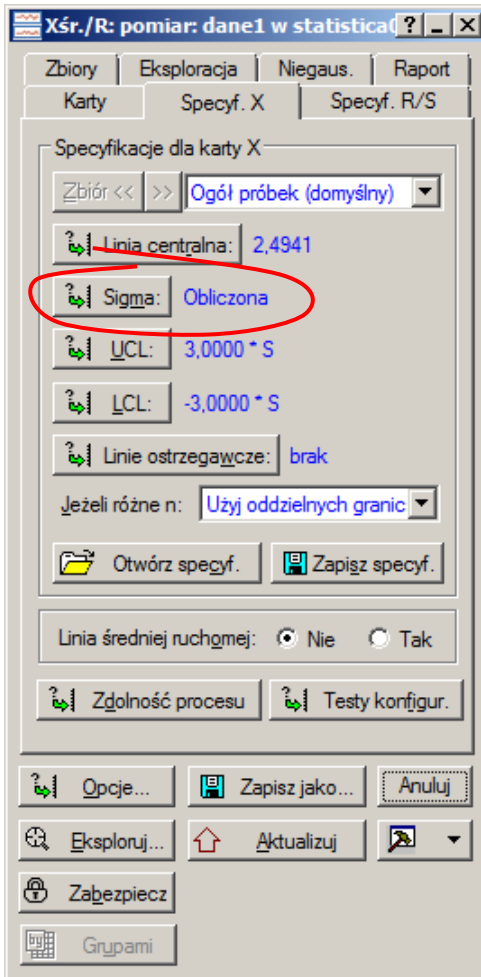
STATISTICA – karta \bar{X} – R (konfiguracja karty – zapis)

modyfikacja specyfikacji z wartości wyznaczanych automatycznie na obliczone



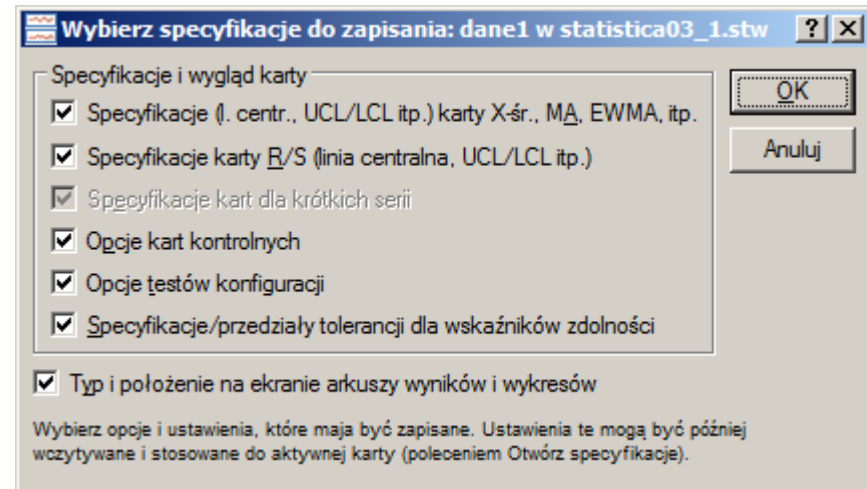
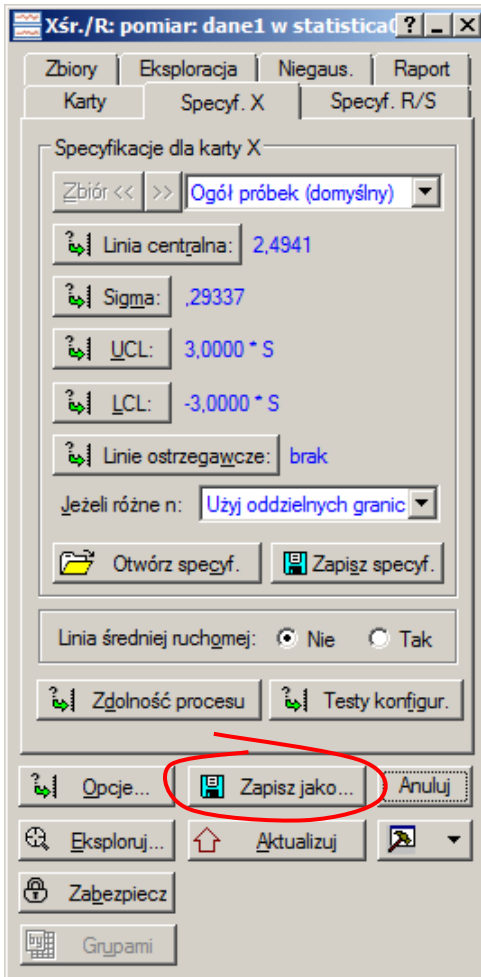
STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (konfiguracja karty – zapis)

modyfikacja specyfikacji z wartości wyznaczanych automatycznie na obliczone



STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ – konfiguracja karty (zapis)

modyfikacja specyfikacji z wartości wyznaczanych automatycznie na obliczone



STATISTICA – karta $\bar{X} - R$ (monitorowanie procesu)

	1	2	3
	zmiana	nr	pomiar
1	1	1	2,7
2	1	2	2,6
3	1	3	2,4
4	1	4	2,1
5	1	5	2,7
6	2	1	2,3

Karty kontrolne: dane2 w statistica03_1.stw

Otwórz plik ze specyfikacją karty

Podstawowe | Liczbowe | Alternatywne | Aktualizacja

- 6 wykresów z kartami \bar{X} -średnie i R
- Karty \bar{X} -średnie i R (ocena liczbowa)
- Pojedyncze obserwacje i Rozstęp ruchomy
- Karta kontrolna C (ocena alternatywna)
- Karta kontrolna P (ocena alternatywna)
- Analiza Pareto

Inne procedury sterowania jakością, jak wskaźniki zdolności procesu (Cp, Cpk, Pp, Ppk...) również dla rozkładów innych niż normalny, plany badań, planowanie doświadczeń (DOE) znajdują się w modułach Analiza procesu i Planowanie doświadczeń.

Otwórz dane

STATISTICA – karta \bar{X} – R (monitorowanie procesu)

X̄s./R: pomiar: dane2 w statistica

Zbiory Eksploracja Niegaus. Raport

Karty Specyf. X Specyf. R/S

Specyfikacje dla karty X

Zbiór << >> Ogól próbek (domyślny)

Linia centralna: 2,4941

Sigma: ,29337

UCL: 3,0000 * S

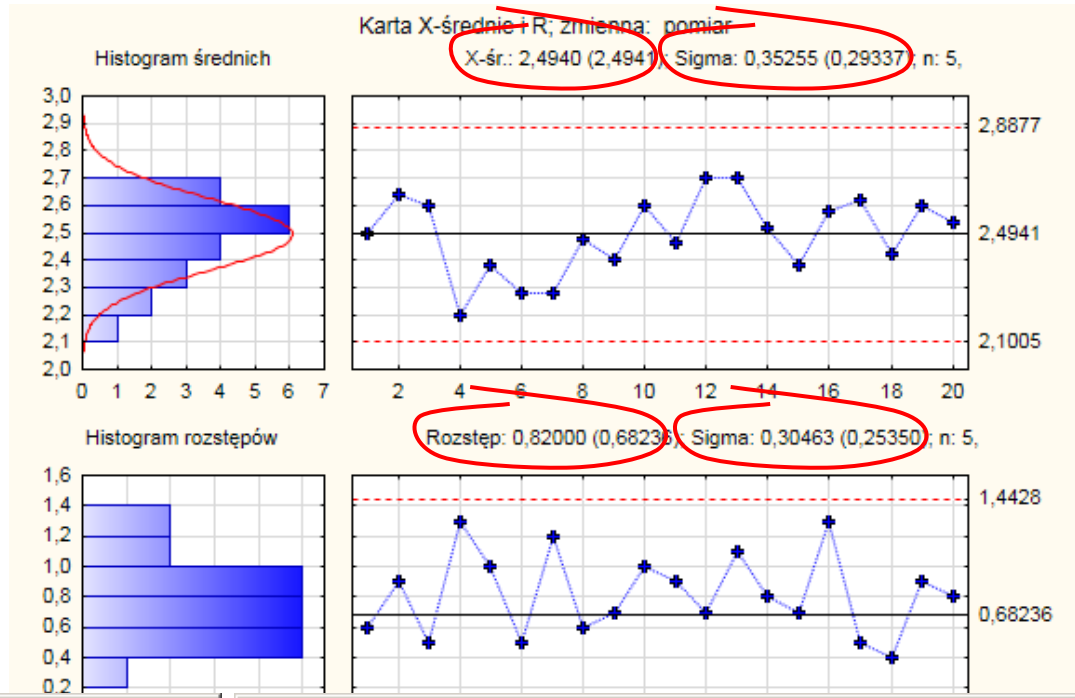
LCL: -3,0000 * S

Linie ostrzegawcze: brak

Jeżeli różne n: Użyj oddzielnych granic

Otwórz specyf. Zapisz specyf.

Linia średniej ruchomej: Nie Tak



Dane: pomiar; Testy konfiguracji (dane2 w statistica03_1.stw)

Strefy A/B/C: 3,000/2,000/1,000 *Sigma

Testy konfiguracji

	od próbki	do próbki
9 po tej samej stronie l. centralnej	OK	OK
6 w trendzie rosnącym/malejącym	OK	OK
14 naprzemiennie w górę i w dół	OK	OK
2 z 3 w strefie A lub dalej	OK	OK
4 z 5 w strefie B lub dalej	OK	OK
15 w strefie C	OK	OK
8 poza strefą C	OK	OK

Linia centralna: 2,494120 Sigma:

Dane: pomiar; Testy konfiguracji (dane2 w statistica03_1.stw)

Strefy A/B/C: 3,000/2,000/1,000 *Sigma

Testy konfiguracji

	od próbki	do próbki
9 po tej samej stronie l. centralnej	OK	OK
6 w trendzie rosnącym/malejącym	OK	OK
14 naprzemiennie w górę i w dół	OK	OK
2 z 3 w strefie A lub dalej	OK	OK
4 z 5 w strefie B lub dalej	OK	OK
15 w strefie C	OK	OK
8 poza strefą C	OK	OK

Linia centralna: 0,682358 Sigma: